

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย รวมถึงกรอบแนวคิด ขั้นตอน และวิธีการทดลอง ตั้งแต่การเตรียมฟิล์มนางเชอร์โโคเนียม ในไตรด์ การศึกษาลักษณะเฉพาะและ สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มนางเชอร์โโคเนียม ในไตรด์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ผู้วิจัยได้แบ่งการดำเนินงานของวิทยานิพนธ์เป็น 2 ส่วนคือ (1) การเตรียมฟิล์มนาง เชอร์โโคเนียม ในไตรด์ (2) การวิเคราะห์ฟิล์มนางเชอร์โโคเนียม ในไตรด์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ

1. การเตรียมฟิล์มนางเชอร์โโคเนียม ในไตรด์ เริ่มจากศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเคลือบฟิล์มนาง ตัวแปรต่าง ๆ และขั้นตอนการเคลือบ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ใช้การเคลือบ ด้วยเทคนิครีแอคตีฟดิซีเมกนิตรอนสปัตเตอริ่ง จากนั้นจึงทดลองเคลือบฟิล์มนางเชอร์โโคเนียม ใน ไตรด์ เพื่อศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สและเวลาในการเคลือบต่อถัมภะเฉพาะและสีของฟิล์มนาง เชอร์โโคเนียม ในไตรด์

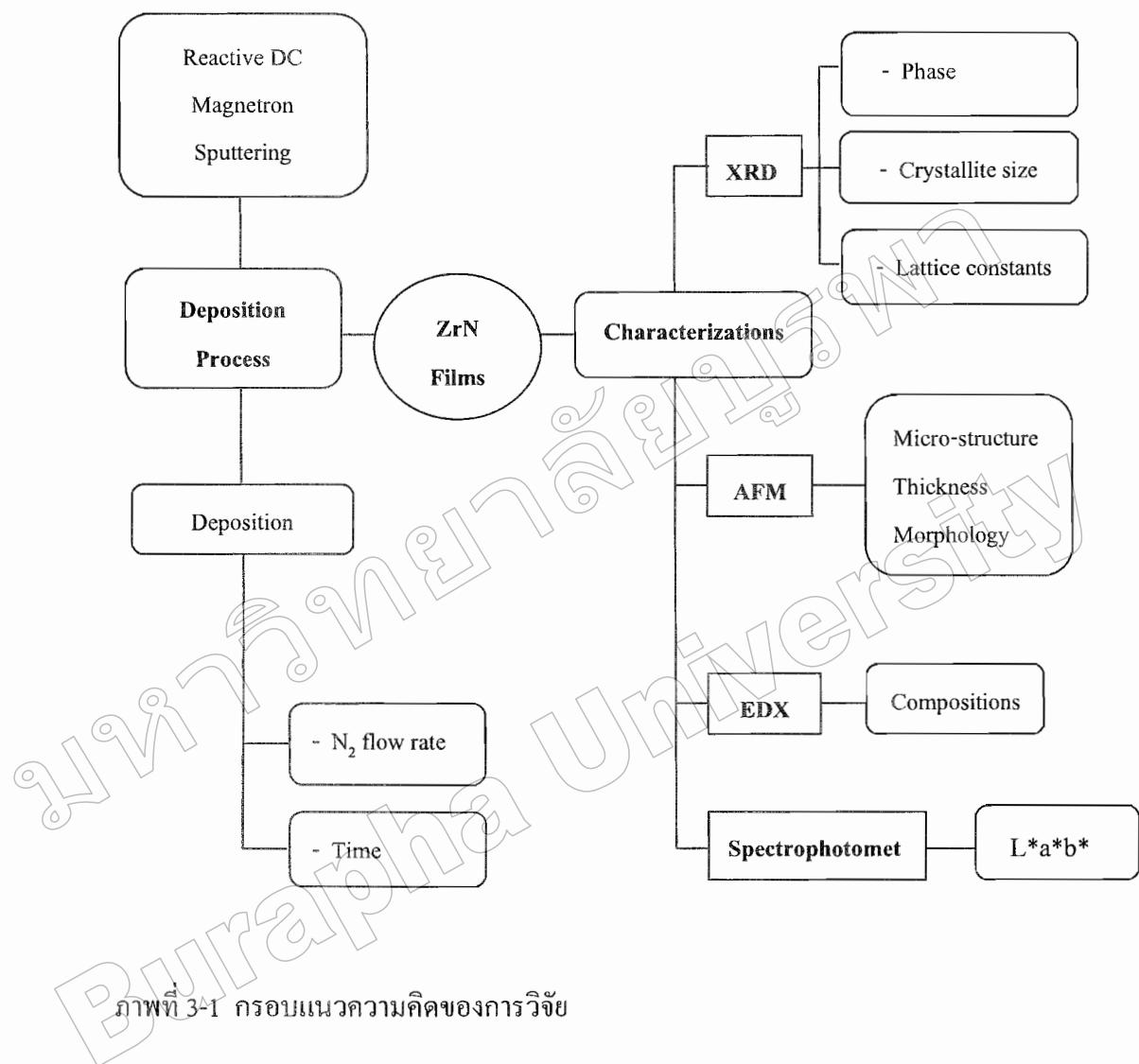
2. การวิเคราะห์ฟิล์มนางเชอร์โโคเนียม ในไตรด์ ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนำฟิล์มที่เคลือบได้ไป วิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม ดังนี้

2.1 X-Ray Diffractometer (XRD) เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แล็ตทิช ของฟิล์ม

2.2 Atomic Force Microscope (AFM) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นผิว และความหนา ของฟิล์ม

2.3 Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) เพื่อศึกษาองค์ประกอบธาตุ ทางเคมีของฟิล์ม

2.4 Spectrophotometer เพื่อศึกษาค่าสีของฟิล์ม ในระบบ CIE L*a*b*



เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) การเตรียมฟิล์มบาง เชอร์โโคเนย์มในไตรค์ (2) การศึกษาค่าสีและลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเชอร์โโคเนย์มในไตรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การเตรียมฟิล์มบางเชอร์โโคเนย์มในไตรค์

1.1 เครื่องเคลือบสูญญากาศระบบวีเอคต์ฟิดีซีเมกานีตระอนสปีตเตอริงที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ เครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสูญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาพิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลือบเป็นเชอร์โโคเนย์ม มีความบริสุทธิ์ 99.97 %

1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิดคือ

- สเตมเลส

- แผ่นซิลิโคน

1.2.3 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 2 ชนิดคือ

- แก๊สอาร์กอนความบริสุทธิ์ 99.999% เป็นแก๊สสปีตเตอร์

- แก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์ 99.995% เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา

2. การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเชอร์โโคเนย์มในไตรค์ที่เคลือบได้

2.1 X-Ray Diffractometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึก ใช้เครื่อง X-Ray

Diffractometer ของ XRD Bruker รุ่น D8 โดยใช้ Cu-K α ($\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$) ของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3 Energy Dispersive X-ray Spectroscopy สำหรับศึกษาองค์ประกอบธาตุทางเคมีของฟิล์ม ใช้เครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectroscopy รุ่น LEO1450VP ของศูนย์ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.4 Spectrophotometer สำหรับศึกษาสีของฟิล์ม ใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น Untra Scan XE ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



ภาพที่ 3-2 เครื่องเคลือบสูญญากาศระบบบรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปีตเตอริง



ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD)



ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)



ภาพที่ 3-5 เครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX)



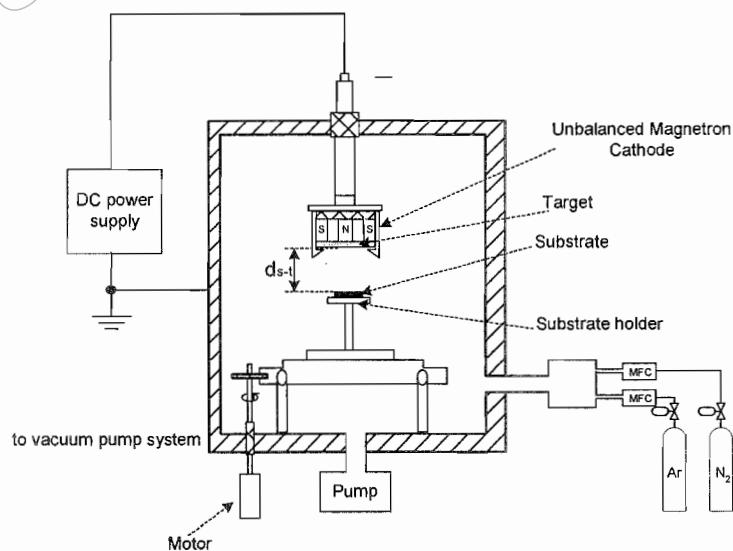
ภาพที่ 3-6 เครื่อง Spectrophotometer

เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบบริแอคตีฟดีซีสปัตเตอริง

ฟิล์มบางเชอร์โโคเนียม ในไตรค์ไนวิทยานินพนธ์นี่ เตรียมจากเครื่องเคลือบในสูญญากาศ ระบบดีซีอันบาลานซ์แมกนีตرونสปัตเตอริง (ภาพที่ 3-2) ด้วยเทคนิครีแอคตีฟสปัตเตอริง ซึ่งเป็นกระบวนการภายนอกให้สภาวะสูญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบูรณ์ตามที่ต้องการ จะต้องลดความดันภายในภาชนะสูญญากาศให้อยู่ในระดับ 10^{-5} mbar ส่วนประกอบของเครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบสูญญากาศ (Vacuum System) และ ส่วนของระบบเคลือบ (Coating System) รายละเอียดดังนี้

1. ส่วนระบบสูญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระบอกทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 353.0 mm สูง 370.0 mm ระบบเครื่องสูบน้ำสูบสูญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอแบบระบบความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบกล โทราร์เป็นเครื่องสูบท้าย การวัดความดันภายในภาชนะสูญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดยใช้หัววัดแบบพิรานี รุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิงรุ่น IKR050

2. ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนเตรียมฟิล์มบางเชอร์โโคเนียม ในไตรค์ประกอบด้วย หัวแมกนีตرونค่าโอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50.0 mm ระบบความร้อนด้วยน้ำติดตั้งเป็นเชอร์โโคเนียม (99.97%) ที่ค่าโอด พื้นผิวเรียบใส่ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ใช้เก๊อสาร์กอนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ ใช้แก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา สำหรับการจ่ายแก๊สสาร์กอนและแก๊สไนโตรเจนในกระบวนการเคลือบควบคุมด้วย Mass Flow Controller ของ MKS type247D



ภาพที่ 3-7 ไ/doะแกรมของเครื่องเคลือบ

การสร้างสภาวะสูญญากาศ

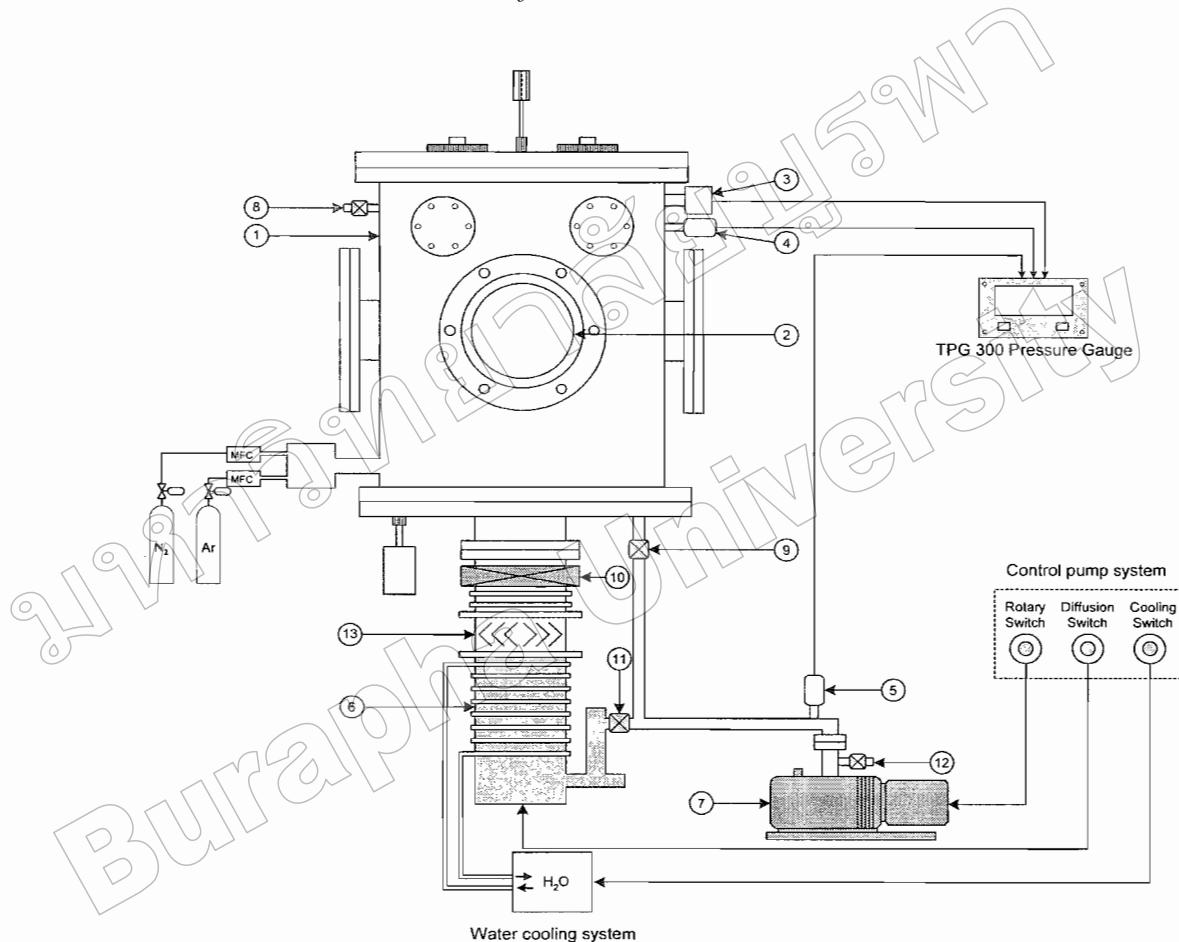
ก่อนทำการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีสปีตเตอริง ต้องทำความดันในภาชนะสูญญากาศให้อยู่ในสภาวะสูญญากาศที่ระดับสูญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ 10^{-3} - 10^{-5} mbar เพื่อลดการปนเปื้อนของฟิล์มที่เคลือบได้เนื่องจากการคงค้างของแก๊สในภาชนะสูญญากาศ (Residual Gas) การสร้างสภาวะสูญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบสูญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอ (Diffusion Pump) หมุนหลังด้วยเครื่องสูบกลไตรารี (Rotary Pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสูญญากาศด้วยท่อและมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด (ภาพที่ 3-8) โดยในตอนดันใช้เครื่องสูบกลไตรารีเพื่อลดความดันในภาชนะสูญญากษาจากความดันบรรยายกาศเป็นความดันต่ำประมาณ 10^{-2} mbar ต่อมาก็ใช้เครื่องสูบแบบแพร่ไอ เพื่อลดความดันในภาชนะสูญญากษาจาก 10^{-2} mbar ให้ลดลงอยู่ในช่วงความดัน 10^{-5} mbar

สำหรับขั้นตอนการสร้างสภาวะสูญญากาศมีดังนี้

1. ตรวจเช็ควาล์วหยาบ (หมายเลข 9) วาล์วท้าย (หมายเลข 11) และวาล์วสูญญากาศสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิตซ์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่างๆ ของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดัน และระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบสูญญากาศเป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิตซ์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบกลไตรารี (หมายเลข 7) ทำงาน
3. เริ่มสูบอากาศจากเครื่องสูบแบบแพร่ไอ โดยใช้เครื่องสูบกลไตรารี โดยเปิดวาล์วท้าย เพื่อให้เครื่องสูบกลไตรารีสูบอากาศออกจากเครื่องสูบแบบแพร่ไอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบแบบแพร่ไอ เมื่ออ่านจากพิรานีเกจ (หมายเลข 4) มีค่า้อยกว่า 10^{-2} mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบแบบแพร่ไอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิตซ์ Diffusion เพื่อให้ตัวทำความสะอาดร้อนของเครื่องสูบแบบแพร่ไอทำงานเป็นการเริ่มต้นนำมัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มนำมันนำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางในภาชนะสูญญากาศ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจความดันในภาชนะสูญญากษาซึ่งคงอยู่ในสภาวะเป็นสูญญากาศ หรือไม่ ถ้าซึ่งเป็นสูญญากาศก็ทำการเปิดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ จนความดันในภาชนะสูญญากษาเท่ากับความดันบรรยายกาศ หลังจากนั้นทำการเปิดฝาครอบภาชนะสูญญากาศออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปวาง ปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสภาวะสูญญากาศขั้นต้นในภาชนะสูญญากาศโดยใช้เครื่องสูบกลไตรารี โดยการปิดวาล์วท้าย และเปิดวาล์วหยาบเพื่อให้เครื่องสูบกลไตรารีสูบอากาศออกจากภาชนะสูญญากาศ จนความดันในภาชนะสูญญากาศ มีค่าประมาณ 10^{-2} mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)

6. เมื่อตั้มนำมันจนครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาวะสุญญากาศสูง ในภาชนะสุญญากาศด้วยเครื่องสูบแบบเพร์ไโอลโดยปิดวาล์วหายใจแล้วเปิดวาล์วท้าย หลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญากาศเพื่อให้เครื่องสูบแบบเพร์ไโอลสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศเพื่อทำความสะอาดด้านในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับสภาวะสุญญากาศสูง หรืออยู่ในช่วง 10^{-5} - 10^{-6} mbar

7. จับเวลาและรอจนความดันในภาชนะสุญญากาศมีค่าประมาณ 5×10^{-5} mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น (P_b) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มบางเชอร์โคเนียมในไตรด์

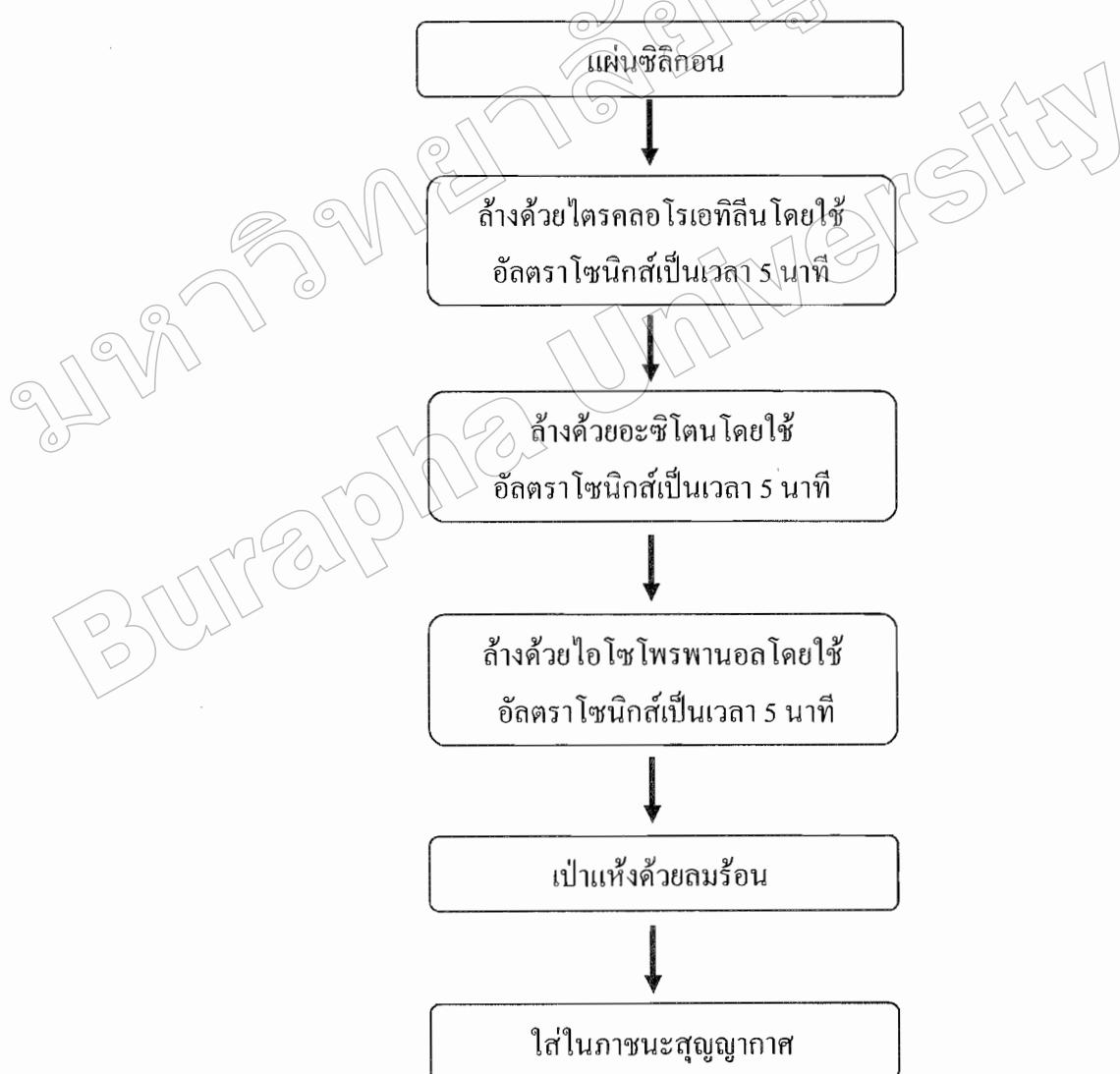


ภาพที่ 3-8 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ของระบบเคลือบสปัตเตอร์

- | | |
|---|---|
| 1. ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum Chamber) | 2. หน้าต่าง (Window) |
| 3. นาครวัดความดันแพนนิ่ง (Penning Gauge) | 4. นาครวัดความดันพิรานี (Pirani Gauge) |
| 5. นาครวัดความดันแบบพิรานี (Pirani Gauge) | 6. เครื่องสูบแบบเพร์ไโอล (Diffusion Pump) |
| 7. เครื่องสูบกลไกโรตารี (Rotary Pump) | 8. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 9. วาล์วหายใจ (Roughing Valve) | 10. วาล์วสุญญากาศสูง (High Vacuum Valve) |
| 11. วาล์วท้าย (Backing Valve) | 12. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 13. แบฟเฟล (Baffle) | |

การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์มบางเชอร์โคเนียมในไตรค์

ที่นี่ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขัดสิ่งสกปรก ได้แก่ คราบฝุ่น ไขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้วัสดุรองรับที่ไม่มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวน้ำของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิกส์ เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตนโดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำไปล้างต่อ ด้วยไอโซโปรพานอล (Isopropanol) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 5 นาที นำวัสดุรองรับขึ้นด้วยคีมคีบ เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสูญญากาศเพื่อรอการเคลือบ ดังแสดงในภาพที่ 3-9



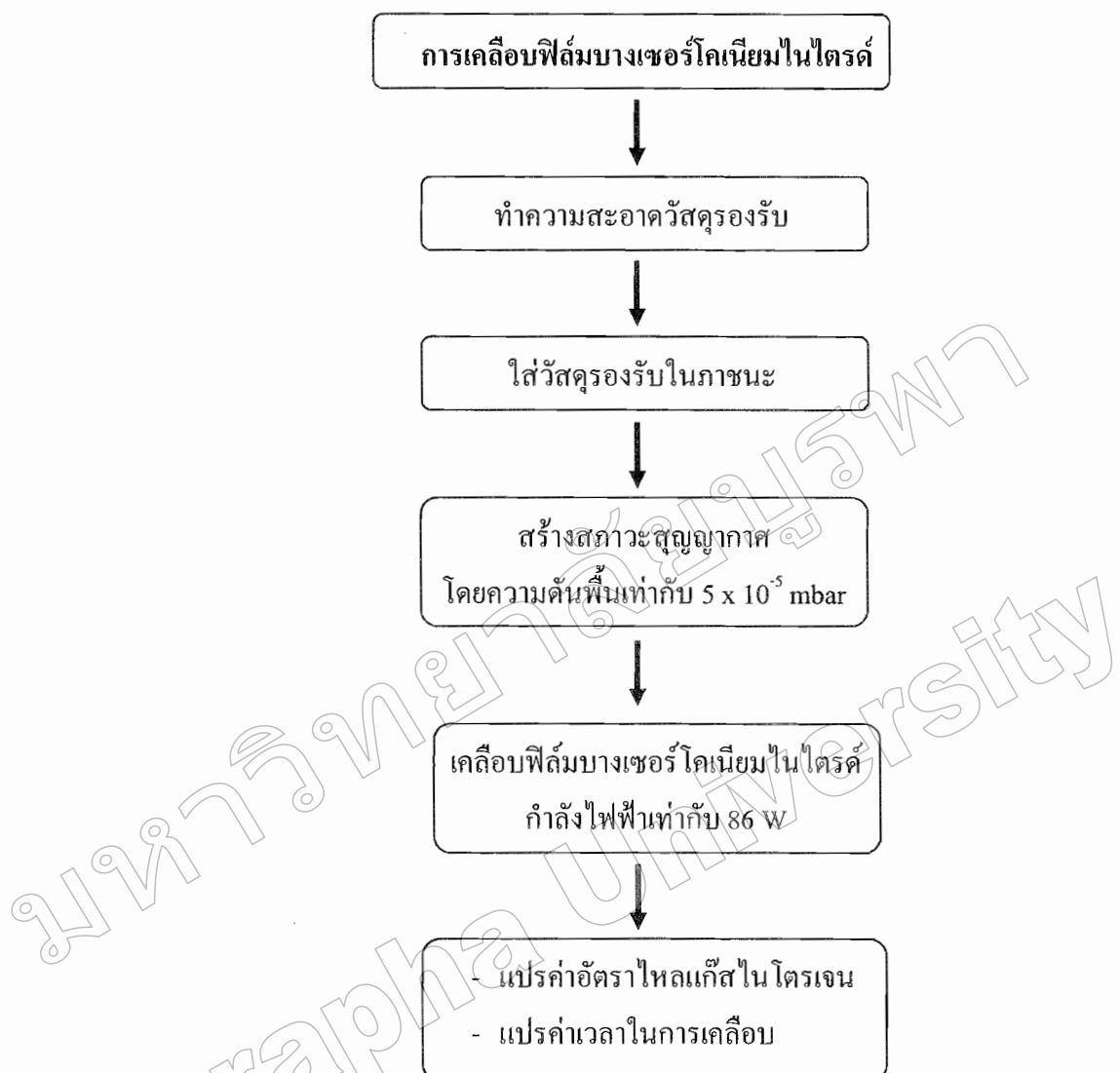
ภาพที่ 3-9 การล้างวัสดุรองรับ

การเคลือบฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์

การเคลือบฟิล์มบางในภาชนะสูญญากาศด้วยวิธี รีแอกตีฟดีซีแมกนีตรอนสปีตเตอริง มีรายละเอียดพื้นฐานได้ดังนี้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกติดตั้งเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อ ศักย์ไฟฟ้าลงเข้ากับขั้วคาโทดและต่อศักย์ไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสูญญากาศ เป้าเชอร์โโคเนียมจะถูกติดตั้งกับขั้วคาโทด โดยด้านบนของคาโทดจะต่อ กับระบบไอลิเวียนน้ำเย็น เพื่อใช้ระบายน้ำร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณคาโทดจากการสปีตเตอร์ของไอลิเวนาร์กอนที่บริเวณ ผิวน้ำเป้าสารเคลือบ ส่วนวัสดุรองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวางที่สามารถเคลื่อนที่ ขึ้นลงได้เพื่อปรับระหัสห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ และมีอุปกรณ์ Control Unit ที่ เชื่อมต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) ใช้บังคับการทำงานของเครื่องควบคุมการปล่อยแก๊ส อย่างละเอียด เพื่อควบคุมอัตราการไอลิเวนแก๊สสารก่อนและในไตรเจนที่เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ โดยค่าอัตราการไอลิเวนแก๊สมีหน่วยเป็น Standard Cubic Centimeter per Minute at STP (scm)

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์มีรายละเอียดดังนี้

1. นำวัสดุรองรับที่เตรียมไว้วางบนแท่นวางวัสดุรองรับ แล้วปิดฝาภาชนะสูญญากาศ
2. ตัดความดันภายในภาชนะสูญญากาศเท่ากับ 5×10^{-5} mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น (P_b) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน P_b ที่อ่านได้
3. ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สสารก่อนและแก๊สไนโตรเจน เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง
4. จ่ายศักย์ไฟฟ้าลงให้แก่คาโทด จนเกิดโกลว์ดิสชาร์จ (ชัตเตอร์บังคงปิดอยู่) เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเคลือบฟิล์มบาง โดยปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าออก เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ พร้อมทั้ง บันทึกผลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (ΔV) ค่ากระแสไฟฟ้า (I) และความดันรวม (P) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่ม เคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์ม ตามเวลา (t) ที่กำหนด
5. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สสารก่อน ปิดแก๊สไนโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสูญญากาศ เพื่อนำวัสดุรองรับออก



ภาพที่ 3-10 การเคลือบฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์

การวิเคราะห์ฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์

การวิเคราะห์ฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ในงานวิจัยนี้ คือศึกษาโครงสร้างผลึก ความหนาและลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบของชาตุทางเคมี และสีของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ รายละเอียดมีดังนี้

1. โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ นำฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ที่เคลือบได้มาศึกษาโครงสร้างผลึก Texture coefficient ขนาดผลึก ค่าคงที่แล็ตทิช ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ โดยนำฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอนนั้น มาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่เกิดขึ้น โดยจะใช้ Cu-k α เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ใน Mode Low Angle กำหนดมุมวัดอยู่ในช่วง 20° - 80° สเปกตรัมที่วัดได้จะบันทึกอยู่ในรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เปรียบเทียบค่ามุม 20° ที่ตำแหน่งความเข้มสูงสุดกับมาตรฐานอ้างอิงของแฟ้ม JCPDS เพื่อหารูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้ต่อไป

1.2 การหา Texture coefficient ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ หาได้จากอัตราส่วนความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของระบบที่สนใจต่อกำไรการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ของระบบทั้งหมด ดังสมการที่ 3-1 (Huang, Ho, & Yu., 2007) ในการคำนวณหา Texture coefficient ของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์

$$\text{Texture coefficient} = \frac{I_{hkl}}{\sum_n I_{hkl}} \quad (3-1)$$

เมื่อ I_{hkl} คือความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ระบบผลึก ($h k l$)

$\sum_n I_{hkl}$ คือผลรวมของความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ระบบผลึก ($h k l$) ทั้งหมด

1.3 การหาขนาดผลึกของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์สามารถหาได้จากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มจากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้สมการของ Scherrer ดังสมการที่ 3-2 ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่ได้หลังการเคลือบ

$$L = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (3-2)$$

เมื่อ L คือ ขนาดของผลึกฟิล์มฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์
 k คือ ค่าคงที่เท่ากับ 0.94

λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ ($\text{CuK}_\alpha = 1.5406$)

β คือ ความกว้างครึ่งหนึ่งของพีกที่มีค่าความเบื้องสูงสุด (FWHM)

θ คือ ครึ่งหนึ่งของมุมตรงจุดศูนย์กลางพีก

1.4 การหาค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ หาได้จากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์ม จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้สมการ การหาระยะห่างระหว่างรั้งนานาบผลึกของฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบเฟชเซนเตอร์คิวบิก ดังสมการที่ 3-3 ในการคำนวณหาค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่ได้หลังการเคลือบ

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2} \quad (3-3)$$

เมื่อ d_{hkl} เป็นระยะห่างระหว่างรั้งนานาบผลึก ($h k l$) (d -spacing)

h, k, l เป็นรั้งนานาบผลึก

a เป็นค่าคงที่แลตทิช

2. การหาความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ โดยนำรัศมีร่องรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวัดความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เบื้องขนาดเล็กจากซิลิกอนในไตรด์เคลื่อนที่กราดบนผิวฟิล์มบางเพื่อตรวจวัดความหนา และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ พร้อมวัดค่าความหยาบผิว
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุทางเคมีบนฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ ทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectroscopy เพื่อศึกษาองค์ประกอบธาตุทางเคมีบนฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ โดยอาศัยการเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะตัวของธาตุแต่ละชนิด ซึ่งพิจารณาฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์บนชิ้นงานได้จากอัตราส่วนของ N : Zr ที่แสดงออกมา
4. การวัดสีของฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ วัดด้วยเครื่อง Spectrophometer เพื่อศึกษาสีในระบบ CIE L*a*b* บนฟิล์มบางเชอร์โโคเนียมในไตรด์ โดยอาศัยการวัดปริมาณการสะท้อนแสงเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงที่เป็น Reflectance Curve วัตถุที่มีสีแตกต่างกันจะมี Reflectance Curve ต่างกัน วัตถุที่มีสีต่างกันเมื่อสะท้อนแสงของสีนั้นออกมาก็จะมีความยาวคลื่นต่างกันตามชนิดของสี

แนวทางการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้เตรียมฟิล์มเซอร์โคเนียมในไตรดับน้ำสตีนเลสและแผ่นชิลิกอนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นนำฟิล์มที่เคลือบได้ไปศึกษาลักษณะเฉพาะ แบ่งเป็น 2 การทดลองดังนี้

การทดลองที่ 1 ผลของอัตราการไหลของแก๊สในไตรเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลของแก๊สในไตรเจนต่อสมบัติของฟิล์มที่ได้

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมในไตรดับน้ำสตีนเลส และแผ่นชิลิกอน โดยปรับค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพื่อหาอัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่เหมาะสม สำหรับเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมในไตรด้โดยกำหนดให้แก๊สรักษาอุณหภูมิเท่ากับ 20 sccm และปรับค่าในไตรเจนเท่ากับ 0.5 sccm, 1.0 sccm, 1.5 sccm, 2.0 sccm, 2.5 sccm, 3.0 sccm ตามลำดับ ควบคุมความดันขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ 6×10^{-3} mbar และใช้เวลาเคลือบนาน 60 นาที (ตารางที่ 3-1)

2. วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แลดติกส์ Texture coefficient ความหนา ลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบธาตุทางเคมี และสี

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมในไตรด์ที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	เซอร์โคเนียม
วัสดุร่องรับ	กระจกสไลด์ และ แผ่นชิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	6×10^{-3}
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบ (cm)	15
อัตราไหลแก๊สรักษา (sccm)	20
อัตราไหลแก๊สในไตรเจน (sccm)	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0
เวลาเคลือบ(min)	60

การทดลองที่ 2 ผลของการเคลือบ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการเคลือบต่อสมบัติของพิล์มที่ได้
วิธีการทดลอง

1. การเคลือบพิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบพิล์มบางชอร์โคเนียมในไตรค์บันสแตนเดส และแผ่นซิลิกอน โดยแบรค่าเวลาเคลือบเพื่อศึกษาผลของการเคลือบต่อลักษณะเฉพาะของพิล์มบาง เชอร์โคเนียมในไตรค์โดยกำหนดให้แก๊สรักอนและแก๊สไนโตรเจนคงที่เท่ากับ 20 sccm และ 1.5 sccm ตามลำดับ ควบคุมความดันขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ 6×10^{-3} mbar และแบรค่าเวลาเคลือบ ในช่วง 30 นาทีถึง 150 นาที รายละเอียด ดังตารางที่ 3-2

2. วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างพล็อกขนาดพล็อก ค่าคงที่แลตทิส Texture coefficient ความหนา ลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบมาตรฐานเคมี และสี

ตารางที่ 3-2 เจื่อนในการเคลือบพิล์มบางชอร์โคเนียมในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่างๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	เชอร์โคเนียม 99.97%
วัสดุรองรับ	กระเจกสไลด์ และ แผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	6×10^{-3}
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบ (cm)	15
อัตราไฟล์แก๊สรักอน (sccm)	20
อัตราไฟล์แก๊สไนโตรเจน (sccm)	1.5
เวลาในการเคลือบ (min)	30, 60, 90, 120, 150